

## FAPG150D 全自动双面探针台

针对功率型DIODE、MOSFET、IGBT等组件的晶圆测试

PEGASUS FAPG150D是一台双面自动化探针结构的探针台，手臂自动取晶圆至预对准器调平及点测位置测试，全圆式夹片盘可提供稳定且快速的测试环境，针对不同应用设定最佳的点测速度与针痕，并可因客户需求提供定制化的设计。



### 性能特点

- 中文Windows操作接口，操作简易
- 可建立不同产品配置文件
- CCD Wafer自动调平及寻找起测晶粒
- 模块化电控结构，易于维修
- 高精密马达驱动，提供安静的运行环境
- 可同时放置2组cassette
- 预对准器校正wafer
- TTL/RS232通讯方式，可搭配各厂测试机
- 优越的点测速度与极佳的探针针痕
- 可因客户需求进行定制化设计
- 可支持6"和4"夹片盘
- 简易操作平台及游戏杆设计

## FAPG150D 全自动双面探针台

### 技术规格

#### X/Y轴

- 架构：高精度循环式滚珠螺杆
- 行程：285mm × 250mm
- 解析度：0.5 μm
- 精度：≤± 4 μm /203mm
- 重复性：≤± 4 μm /203mm

#### 夹臂

- 行程：20mm
- 解析度：1 μm
- 精度：≤±2 μm
- 重复性：≤±4 μm

#### 夹片盘

- 材质：聚醚醚酮 Peek
- 夹片尺寸：可支持6”or 4”

#### 平台

- 打墨器：1组
- 抗干扰铝壳接线盒：1组

#### 测试时间

Test Time (ms)		Index Step(μm)			
		300	500	1000	2000
Chuck Lift (μm)	300	42	47	56	70
	500	52	57	66	80
	800	62	67	76	90
	1000	68	74	83	97

#### 显微镜

- 数位显微镜
- 内建LED光源
- 倍率: X20 ~ X90

#### 外观尺寸

- 1020(D) × 1360(W) × 1465(H) mm  
(不含屏幕，信号灯)

#### 重量

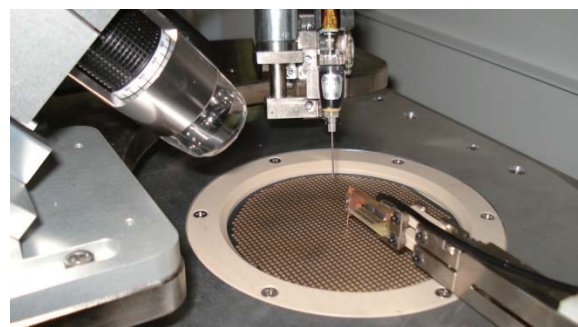
- 490Kg(不含测试机)

#### 真空

- 4-6Kgf/cm<sup>2</sup>

#### 气压

- 0.5MPa



点测平台